

アルファクス 株式会社



代表取締役社長
石塚 静

半導体検査装置で国内 トップシェア

神奈川県
川崎市中原区下新城3-13-13

1979年(昭和54年)設立
TEL 044-755-6661

<http://www.alphax.co.jp/>

世界で初めて、半導体レーザーの性能が分かるだけでなく、その製品の良否も判定できる半導体検査装置の開発・販売に成功し、今では半導体レーザー検査装置でシェア60%を誇る。

半導体レーザー検査装置でシェア60%

同社は、世界で初めて、半導体レーザーの性能が分かるだけでなく、その製品の良否も判定できる半導体検査装置の開発・販売に成功した。しかし、当初の装置は、10個の半導体レーザーをカートリッジに埋め込み、性能を1つずつ順番に測っていたため、10個を調べるのに20分近くかかっていた。その後の開発により、半導体レーザーのいろいろな性能を同時並行的に測定し、1個当たりの測定時間を3秒以内と従来の装置より40倍以上早く測定ができる装置の開発・販売に成功したことで、今では、半導体レーザー検査装置でシェア60%を獲得し、国内有数のメーカーとして君臨している。



高速半導体レーザーチップ特性評価装置

ニーズに合わせた半導体レーザー検査装置

今では、顧客ニーズに基づき、様々な機種 of 検査装置を開発・販売している。例えば、パッケージ化された半導体レーザーで最大2000素子の電氣的諸特性（順電流対光出力、順電流対電圧、レーザーの波長、レーザービームの拡がり角、偏光角など）を高速に自動測定・選別する装置やチップ状態の半導体レーザーを低温、常温及び高温状態で高速に測定し、特性別に分類する装置がある。

その他にも、槽内密閉による外部温度コントローラ機能を有することで、半導体レーザーの電氣的・光学的諸特性の温度依存性を自動測定できる装置もある。



高速CANタイプ半導体レーザー特性評価装置



半導体レーザー温度特性評価装置